

# 硅片测试 高分子材料第三方机构 百检网

产品名称	硅片测试 高分子材料第三方机构 百检网
公司名称	上海百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

## 产品详情

硅片测试报告在哪做?百检网第三方检测机构提供硅片测试服务,工程师一对一沟通,确认硅片测试方案后安排实验室进行检测。关于硅片测试标准及项目内容如下。

测试周期:7-15个工作日

### 硅片测试范围

单晶硅片,太阳能硅片,光伏硅片,半导体硅片,切割硅片,镀膜硅片,清洗硅片,抛光硅片等。

### 硅片测试项目

电阻率测试,翘曲度测试,厚度测试,表面粗糙度测试,燃烧测试,弯曲度测试,平整度测试,绒面反射率测试,碳氧含量检测,压电系数测试,ECV测试,负载测试,硬度测试,抗弯强度测试,晶圆测试,表面杂质测试,表面有机物测试,少子寿命测试,颗粒度测试,表面接触角测试等。

### 硅片测试标准

GB/T 29055-2019 太阳能电池用多晶硅片

GB/T 26068-2018 硅片和硅锭载流子复合寿命的测试非接触微波反射光电导衰减法

GB/T 37051-2018 太阳能级多晶硅锭、硅片晶体缺陷密度测定方法

GB/T 32814-2016 硅基MEMS制造技术基于SOI硅片的MEMS工艺规范

GB/T 24578-2015 硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法

GB/T 32280-2015 硅片翘曲度测试自动非接触扫描法

GB/T 32281-2015 太阳能级硅片和硅料中氧、碳、硼和磷量的测定二次离子质谱法

GB/T 30859-2014 太阳能电池用硅片翘曲度和波纹度测试方法

GB/T 30860-2014 太阳能电池用硅片表面粗糙度及切割线痕测试方法

GB/T 30869-2014 太阳能电池用硅片厚度及总厚度变化测试方法

GB/T 30701-2014

表面化学分析硅片工作标准样品表面元素的化学收集方法和全反射X射线荧光光谱法测定

GB/T 29505-2013 硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法

GB/T 29507-2013 硅片平整度、厚度及总厚度变化测试自动非接触扫描法

GB/T 6616-2009 半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法非接触涡流法

GB/T 6617-2009 硅片电阻率测定扩展电阻探针法

GB/T 6618-2009 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619-2009 硅片弯曲度测试方法